

Ingénieur(e) métrologie, microscopie à force atomique H/F

Informations générales



Entité de rattachement

Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.

Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un socle de recherche fondamentale. Le CEA s'engage depuis plus de 75 ans au service de la souveraineté scientifique, technologique et industrielle de la France et de l'Europe pour un présent et un avenir mieux maîtrisés et plus sûrs.

Implanté au cœur des territoires équipés de très grandes infrastructures de recherche, le CEA dispose d'un large éventail de partenaires académiques et industriels en France, en Europe et à l'international.

Les 20 000 collaboratrices et collaborateurs du CEA partagent trois valeurs fondamentales :

- La conscience des responsabilités
- La coopération
- La curiosité

Référence

2024-32129

Description de la Direction

Description de la Direction.

Le CEA LETI (Laboratoire d'Electronique et des Technologies de l'Information) à Grenoble est un des centres de recherche technologique leaders mondiaux en matière de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC). Sa mission première est de développer des solutions innovantes dans ses différents domaines de compétences et de les transférer à l'industrie dans le cadre de partenariats industriels, afin de répondre aux besoins de marchés à forte croissance.

Description de l'unité

Description de l'unité

Au sein du Département des Plateformes Technologiques, le Service de Métrologie et Caractérisation Physique (SMCP) a pour objectif de définir, développer et mettre en œuvre les équipements ou techniques de contrôle, métrologie, défektivité, et nano-caractérisation nécessaires aux programmes de recherche en micro et nanotechnologies (microélectronique, microsystèmes, photonique, ...).

Dans ce contexte, le Service doit maintenir ses effectifs pour faire face aux besoins croissants, en terme de métrologie et défektivité aux échelles micro et nanométrique, des technologies développées dans les salles blanches du CEA LETI.

Description du poste

Domaine

Instrumentation, métrologie et contrôle

Contrat

CDI

Intitulé de l'offre

Ingénieur(e) métrologie, microscopie à force atomique H/F

Statut du poste

Cadre

Description de l'offre

Les besoins, dans le domaine de la caractérisation par microscopie à force atomique (AFM) des lots en salle blanche, nécessitent le recrutement d'un(e) ingénieur(e). Le ou la candidat(e) sera intégré(e) à l'équipe de microscopie AFM in line du Laboratoire d'Analyses de Surface et Interface du SMCP et travaillera en horaires collectifs journée. Il (elle) devra après une période de formation aux équipements et logiciels de suivi de l'activité :

- Réaliser les caractérisations par microscopie AFM sur les plaques de 200 ou 300 mm des lots de la salle blanche et rendre compte des résultats aux ingénieurs procédés ou filières ;
- Garantir le fonctionnement en termes de procédés d'un AFM automatique dont il aura la charge et assurer la formation et l'accompagnement des utilisateurs ;
- Définir les développements méthodologiques et leur capitalisation en proposant les évolutions nécessaires et en assurant la valorisation de son activité.

Outre l'activité principale décrite ci-dessus, le ou la candidat(e) participera à l'organisation de l'activité de l'équipe, en lien avec le chef de laboratoire, dans l'objectif d'optimiser les temps de cycle des analyses. En particulier, il interviendra en direct avec les ingénieurs procédés ou filières afin de valider leurs demandes. En lien avec l'équipe maintenance et les équipementiers, le candidat prendra également part au pré-diagnostic de pannes des microscopes.

Profil du candidat

Formation : Vous devrez à minima être titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 5 (master, ingénieur) en physique, matériaux ou microélectronique avec une première expérience en microscopie AFM. Vous parlez et écrivez l'anglais couramment (niveau B2 minimum CECRL). Vous êtes également à l'aise avec l'outil informatique Office. Le traitement de données par Python serait un plus.

Expérience professionnelle souhaitée : première expérience en micro-électronique et caractérisation par microscopie AFM de 3 à 5 ans.

Qualités adaptées : Le candidat devra savoir travailler en équipe, avoir l'esprit de synthèse et faire preuve d'autonomie, de rigueur et d'organisation.

Localisation du poste

Site

Grenoble

Localisation du poste

France, Auvergne-Rhône-Alpes, Isère (38)

Ville

Grenoble

Demandeur

Disponibilité du poste

02/09/2024